3軸角度センサに関する研究

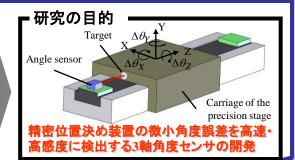
ナノ計測制御学分野 / Nano-Metrology and Control Lab.

研究の背景

超精密位置決め装置の角度誤差計測の要求

高精度光学素子の利用拡大や半導体プロセスの微細化に 伴って、超精密加工機や半導体露光装置などの超精密機械に はSub-nmオーダの超精密位置決めが要求されている.

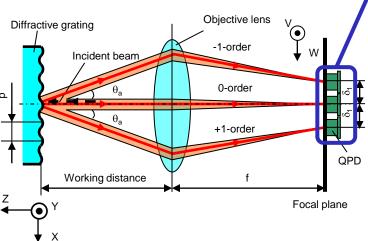
・リニアステージ等の精密位置決め装置の運動誤差の中で、ス テージの姿勢変化による角度誤差は位置決め誤差の一因とな るため、姿勢変化を高精度に計測し、制御する必要がある.



原理

<u>回折格子からの回折光と4分割フォトダイオード(QPD)による光スポット変位検出を組み合わせたレ</u>

ートコリメーション法を採用した3軸角度変化の一括検出



<u>、サ感度はレンズの焦点距離に依存しないため。</u> を拡大することなく高感度化が可能

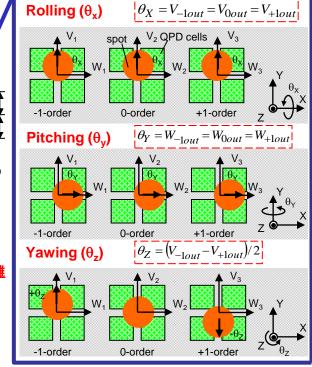
$$S_{\theta z} \propto \frac{D}{p} S_{\theta x}, S_{\theta y} \propto \frac{D}{\lambda}$$

 S_{θ} : Sensitivity

D: Beam diameter

p: Pitch of the grating : Wavelength



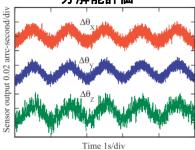


非線形誤差評価

• $\Delta\theta_{\rm X}$ (\Box \Box \Box \Box) 2.68 arc-second

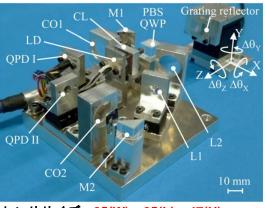
 $\Delta\theta_{\rm v}$ (ピッチ) 2.06 arc-second $\Delta\theta_{\rm z}$ (3-) 2.11 arc-second (測定レンジ40 arc-second)

分解能評価



軸0.01 arc-secondの 微小角度変化の検出に成功 (1 Hzの振動)

試作した3軸角度センサ



センササイズ 85(W)×85(L)×47(H) mm